

談話室

第23回表面科学基礎講座 —表面・界面分析の基礎と応用—

大岩 烈

アルバック・ファイ (株)
☎ 253-0084 神奈川県茅ヶ崎市門蔵 370
(1998年1月20日受理)

The 23rd Surface Science Lecture Course

Retsu OIWA

ULVAC-PHI, Inc.
370 Enzo, Chigasaki, Kanagawa 253-0084

(Received January 20, 1998)

日本表面科学会企画委員会が中心となり、1997年6月11日から6月13日までの3日間、東京・お茶の水の総評会館において「表面・界面分析の基礎と応用」と題した表面科学基礎講座が開催された。毎年2回(春; 東京, 秋; 関西)開催され、常に好評を博してきた。今回も100名をこえる参加者があり、無事終了することができた。

本講座は、主として表面と関わり合いのある若手の研究者が企業、研究所、大学を問わず表面分析の基礎を勉強するために参加している。参加者の期待に添うようにできるだけ「基礎」を取り上げる形式が継承されてきた。また、広い範囲の分野、多くの表面分析法をカバーするように努めてきた。講師は、それぞれの分野において最先端で活躍されておられる方々にお願いしてきた。その一方で、企画委員会としては、「基礎講座」にふさわしい講座にすることを最大の目標としてきた。本講座の趣旨を講師の方々に理解していただき、できる限りわかりやすい講義になることを目的とし、また、参加者のアンケート結果、反省会からのフィードバックができるだけ迅速に反映されることを目的として基本的には講師の顔ぶれを変えないことも原則の一つとして運営されてきた。

基礎講座の最近の一つの動向として、講義後における有意義で活発な質疑応答時間をあげることができ、講義の内容をより理解を深めるといふことにとどまらず、

身近な問題解決のための質問から最先端材料にかかわる難解な質問までさまざまである。講師の方々も親身になって答えていただいて、直接関係のない分野の質問でも大変に参考になることが多い。アンケートの中にも「基礎」ばかりでなく「材料別に講義をしてほしい」、「応用編、アドバンスコースを企画してほしい」など、別の切り口での表面分析の講義を望まれる方々が毎回いる。昨今の表面を応用した分野の広がりやを考慮した「基礎」だけではなく、新しい企画が新たに必要なのかもしれない。今後とも各方面の方々からの意見を取り入れ「基礎講座」をより良い企画にして行くとともに、さらなるニーズにあった企画を今後とも企画委員会で検討していきたいと考えている。

最後に、本講座の企画、運営にご協力いただいた講師の方々、企画委員会、事務局などの多くの関係者に紙面を借りて深く感謝する次第である。

プログラム

月日	講義題目	講師
6月11日(水)	表面・界面分析概論	福田安生 (静大電子研) 一宮彪彦(名大工)
	電子線回折 (LEED, RHEED)	板東義雄(無機材研)
	電子顕微鏡による構造解析	奥村豊彦(日本電子)
	電子線マイクロアナライザ(EPMA) 電子顕微鏡による微小部分分析 質疑応答/まとめ	永田文男(日立計測)
6月12日(木)	走査プローブ顕微鏡(STM, AFM)	野副尚一(物質研)
	赤外分光(FT-IR), ラマン分光	石田英之(東レリサーチセンタ)
	イオン散乱	越川孝範(大阪電通大)
	電子分光装置の基礎 測定データの取り扱い	大岩 烈(アルバック・ファイ) 太田英二(慶応大理工)
6月13日(金)	オージェ電子分光法(AES)	吉原一紘(金材技研)
	X線光電子分光法(XPS)	田沼繁夫(ジャパンエナジー)
	二次イオン質量分析法(D-SIMS)	本間芳和(NTT)
	二次イオン質量分析法(S-SIMS) 質疑応答/まとめ	工藤正博(成蹊大工)